



Maturitní témata z předmětu: Praktická maturitní zkouška

Třída: A4

Školní rok: 2018-2019

1. Měření VA charakteristik a parametrů polovodičových prvků I
2. Měření VA charakteristik a parametrů polovodičových prvků II
3. Měření VA charakteristik a parametrů polovodičových prvků III
4. Měření na TTL obvodech I
5. Měření na elektronických obvodech I
6. Měření na elektronických obvodech II
7. Měření s využitím automatizovaného měřicího systému I
8. Měření s využitím automatizovaného měřicího systému II
9. Měření s využitím automatizovaného měřicího systému III
10. Měření na kamerovém inspekčním systému I
11. Měření na kamerovém inspekčním systému II
12. Programování malých PLC I
13. Modelování regulačních obvodů I
14. Modelování regulačních obvodů II
15. Regulace fyzikální veličiny pomocí PLC a operátorského panelu I
16. Regulace fyzikální veličiny pomocí PLC a operátorského panelu II
17. Regulace fyzikální veličiny pomocí PLC a operátorského panelu III
18. Ovládání elektropneumatických obvodů pomocí PLC a operátorského panelu I
19. Ovládání elektropneumatického obvodu I
20. Logické obvody I
21. Logické obvody II
22. Programování na jednočipových mikrořadičích s využitím integrovaných periférií - I
23. Programování na jednočipových mikrořadičích s využitím integrovaných periférií - II
24. Programování na jednočipových mikrořadičích s využitím integrovaných periférií - III
25. Ovládání modelů technologických celků a reálných zařízení - I
26. Ovládání modelů technologických celků a reálných zařízení - II
27. Ovládání modelů technologických celků a reálných zařízení - III
28. Využití standardních komunikačních rozhraní pro přenos dat - I
29. Využití standardních komunikačních rozhraní pro přenos dat - II
30. Využití standardních komunikačních rozhraní pro přenos dat - III

V Chomutově dne: 27.09.2018

Zpracoval: Ing. Petr Kadeřábek – PPK elektro

Ing. Josef Madaj

Ing. Ludvík Vlček

Schválil: Ing. Jan Lacina

ředitel